

Bases de datos de Patentes

Durante todo el proceso que involucra la creación de un proyecto del que se puede derivar una invención, resulta conveniente la realización de una búsqueda de antecedentes en las bases de datos de Propiedad Industrial. La documentación que genera el proceso de obtener una patente es la principal fuente de información técnica, para el desarrollo de la tecnología. Este es el recurso de primera mano para descubrir tanto el desarrollo que va teniendo una tecnología en particular o producto, como para reconocer si una invención es nueva y tiene nivel inventivo. Se debe tener la competencia de saber buscar si es nueva o no esta información, lo que se conoce como el estado de la técnica.

El buscar la información sobre el estado de la técnica, es posible en bases de datos de acceso gratuito, que contienen más de 70 millones de documentos de patentes de todo el mundo, por ejemplo Esp@cenet (base de datos de la Oficina Europea de Patente), alguna de los cuales corresponden a varias oficinas de patentes nacionales y regionales o de una oficina de PI determinada. Las bases de datos proporcionan información técnica, jurídica y comercial útil para la toma de decisiones. Tomando en cuenta que en las solicitudes de patentes se deben describir las invenciones de tal manera que las personas formadas en el campo de que se trate las puedan reproducir, habrá en este tipo de documentos una información pormenorizada que no se encuentra en las publicaciones científicas clásicas. Es por esto que es la principal fuente de información para buscar el estado de la técnica de una invención dada.

Las bases de datos contienen una carátula que permiten realizar diferentes tipos de búsqueda, de acuerdo a las necesidades de búsqueda, perfil del usuario y quizás posibles limitaciones de información. Por ejemplo en la base de Esp@cenet, contiene diferentes campos de búsqueda, es decir, se puede recuperar información mediante palabras claves en título y/o resumen, por número de solicitud o de publicación, fecha de solicitud, inventor, solicitante, clasificación, número y fecha de prioridad. Cada campo contiene un ejemplo del formato en que se debe introducir la información y en el símbolo i contiene una descripción del campo. Otras bases de datos también tienen una carátula similar a esta.

Antes de iniciar una búsqueda debemos determinar cual será nuestra estrategia utilizada. Para ello podemos definir palabras claves que definan la invención o sinónimos de estas, un punto muy importante que se debe señalar es que una gran parte de los documentos de patentes en estas bases de datos se encuentran en idioma inglés o en el idioma oficial de cada país. Por lo que al momento de hacer una búsqueda es conveniente utilizar términos, generalmente en idioma inglés para abarcar el mayor número posible de información, si la base de datos lo permite, y combinar diferentes campos de búsqueda, por ejemplo palabras claves solicitante, clasificación. Ciertas bases de datos publican documentos en varios idiomas y poseen la herramienta de traductores automáticos con la finalidad de resolver la limitación del idioma.

Los resultados de búsqueda proporcionan información sobre los datos bibliográficos de los documentos de patentes como son: Título, número y fecha de solicitud, inventor, solicitante, clasificación, número y fecha de prioridad, resumen de la invención. En algunas bases de datos se pueden consultar el texto completo de la descripción y reivindicaciones y dibujos, además es posible ver las invenciones relacionadas para una patente o solicitud, a esto se denominada familia de patente y en casos particulares también está disponible el estatus legal de la patente.

La República Dominicana participa en iniciativas como PATENTSCOPE y LATIPAT por lo que usted puede consultar información bibliográfica sobre las solicitudes de patentes que desean acceder a la protección en el territorio nacional.

A continuación se citan las principales bases de datos de patentes de acceso gratuito:

- **USPTO:** Base de datos de patentes en texto completo Estados Unidos. La herramienta PAIR (Patent Application Information Retrieval) proporciona información sobre el estatus de las solicitudes sometidas en la Oficina Americana.
- **ESP@CENET:** Base de datos de la EPO (Oficina Europea de Patentes).
- **LATIPAT- ESP@CENET:** Base de datos de patentes publicadas de Latinoamérica.
- **PATENTSCOPE:** Base de datos de aplicaciones de patentes internacionales de la OMPI (WIPO).
- **DEPATISnet:** Base de datos de patentes de Alemania.
- **PAJ:** Base de datos de la oficina japonesa de patentes.
- **EPO On Line:** Búsqueda del estatus de una aplicación de patente en la Oficina Europea de Patentes.
- **WIPO GOLD:** Conjunto de herramientas gratuitas para la búsqueda de recursos de propiedad intelectual.
- **Google Patent Search:** Búsqueda y obtención a texto completo de todas las patentes de la Oficina de Patentes de EEUU (USPTO) de 1790 a la actualidad. Unos 7 millones de patentes. Prevista ampliación incorporando patentes de otras oficinas nacionales e internacionales.
- **Orange Book:** Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations: Patentes de medicamentos. U.S Food and Drug Administration (FDA).
- **INVENES:** Base de datos de patentes, marcas y modelos de utilidad españoles. OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.
- **Patent Lens:** Acceso gratuito a más de 10 millones de patentes de numerosos países.
- **Patentados.com:** Inventos patentados en España en los últimos 60 años.
- **Patent Data Resource at EBI (Instituto Europeo de Bioinformática):** Proporciona resúmenes de patentes químicas y de secuencias relacionadas al área biotecnología. Permite realizar búsqueda de patentes equivalentes para una invención determinada.

Bases de datos de pago:

- **Derwent Patent Index:** Base de datos con información de patentes de más de 40 países. Es propiedad del grupo Thomson y accesible a través de diversos distribuidores.
- **Dephion:** Sistema integrado de búsqueda de patentes, incluye el acceso al Derwent Patent Indexy a las colecciones de patentes US, EP; DE, JP, CH, WO e INPADOC. Es Propiedad del grupo Thomson.
- **Thomson Innovation:** Sistema integrado de búsqueda de patentes, que incluye además de las colecciones que se indican en DELPHION el acceso a publicaciones científicas.
- **Total Patent:** Sistema integrado de la empresa LEXIS-NEXIS. Las colecciones varían respecto de las de Thomson Innovation.
- **STN** Incluye información sobre patentes, sobre sustancias y productos químicos (REGISTRY) y referencias de documentación publicada, se destaca sus prestaciones con la base de datos Chemical Abstracts.

Clasificación internacional de Patente

Debido a los diferentes idiomas existentes y la diversidad de términos técnicos que pueden emplearse para un mismo objeto, cabe la posibilidad que al momento de realizar una búsqueda se escapen documentos. Por esta razón las oficinas de patentes asignan símbolos de clasificación a los documentos de patente, como parte del proceso de búsqueda y examen, ya que los sistemas de clasificación permiten recuperar con exactitud los documentos mediante estrategias de búsqueda independientes del idioma y la terminología utilizados. Su uso no está restringido ni limitado a las oficinas de patentes, los inventores y los interesados en recuperar información sobre una tecnología determinada pueden utilizar esta importante herramienta a fin de recuperar la información pertinente y relacionadas.

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP o IPC) es el principal sistema de clasificación utilizado por numerosas oficinas de patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971 y administrado por la OMPI, esta prevé un sistema jerárquico de símbolos independientes del idioma para clasificar las patentes y los modelos de utilidad en los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen, esta se revisa continuamente y se encuentra disponible en varios idiomas, entre ellos el español.

Otros sistemas de clasificación utilizados de manera particular por ciertas oficinas de patentes son:

1. Sistema de Clasificación de la Oficina Europea de Patentes (ECLA): tiene una estructura similar a la clasificación internacional, aunque más detallada y está disponible sólo en inglés.
2. Sistema de Clasificación de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (USPC): se aplica únicamente para documentos de Estados Unidos.
3. Clasificaciones de la Oficina Japonesa de Patentes (FI y F-terms).
4. Oficina de Patentes y Marcas de Alemania (clasificación DEKLA).